

	Identifikační karty - Optické paměťové karty - Lineární metoda záznamu - Část 3: Optické vlastnosti a charakteristiky	ČSN ISO/IEC 11694-3 36 9738
---	---	---------------------------------------

Identification cards - Optical memory cards - Linear recording method -
Part 3: Optical properties and characteristics

Cartes d'identification - Cartes à mémoire optique - Méthode d'enregistrement linéaire -
Partie 3: Propriétés et caractéristiques optiques

Identifikationskarten - Optische Speicherkarten - Lineare Aufzeichnung -
Teil 3: Optische Eigenschaften

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 11694-3:2001. Mezinárodní norma ISO/IEC 11694-3:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 11694-3:2001. The International Standard ISO/IEC 11694-3:2001 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut,
2002

63527

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

Citované normy

ISO/IEC 11693:1994 zavedena v ČSN ISO/IEC 11693:1996 (36 9739) Identifikační karty - Optické paměťové karty - Všeobecné charakteristiky, nahrazena ISO/IEC 11693:2000 dosud nezavedenou

ISO/IEC 11694-4:1996 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO/IEC 10373-1:2001 (36 9737) Identifikační karty - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky všeobecných charakteristik

ČSN ISO/IEC 10373-5:2001 (36 9737) Identifikační karty - Zkušební metody - Část 5: Optické paměťové karty

ČSN IEC 50(845):1996 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 845: Osvětlení

Vysvětlivky k textu převzaté normy - viz ČSN IEC 50(845)

anglický termín	obvyklé termíny	použitý termín
1/e ² point	· bod 1/e² · bod pro pokles na (2,718)⁻²	bod 1/e ²
data pattern	· kombinace dat · datový obrazec	kombinace dat
reflectance (845-04-58)	· činitel odrazu (845-04-58) · reflektance · odrazivost	činitel odrazu
reflectivity (845-04-86)	· činitel odrazu tlusté vrstvy (845-04-86) · reflektivita	· činitel odrazu tlusté vrstvy · činitel odrazu (tlusté vrstvy)

Podle A.13.6, ISO/IEC 11694-4 jsou typické hodnoty:

anglický termín	český termín	hodnota
low frequency recovery	obnovení (činitele odrazu) pro nízkou frekvenci	³ 0,9
amplitude comparison	poměr amplitud	³ 0,8
high frequency	vysoká frekvence	80 kHz
low frequency	nízká frekvence	20 kHz
beam diameter	průměr svazku	2,5 mm

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČO 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. V oblastech společného zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu s pravidly určenými Směrnicemi ISO/IEC, část 3.

V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Je nutné upozornit na možnost, že některé z prvků této části ISO/IEC 11694 mohou být předmětem patentových práv. ISO a IEC nenesou odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO/IEC 11694-3 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 *Informační technologie*, subkomisí SC 17, *Identifikační karty a příslušná zařízení*.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání, které bylo podrobena technické revizi.

ISO/IEC 11694 sestává z následujících částí, pod společným názvem *Identifikační karty - Optické paměťové karty - Lineární metoda záznamu*:

- Část 1: Fyzikální charakteristiky
- Část 2: Rozměry a umístění opticky dostupné oblasti
- Část 3: Optické vlastnosti a charakteristiky
- Část 4: Logické struktury dat

Tato část ISO/IEC 11694 je jednou z řady norem popisujících parametry optických paměťových karet a použití takových karet pro uchovávání a výměnu číslicových dat.

Normy připouštějí existenci různých metod záznamu a čtení informace z optických paměťových karet, jejichž charakteristiky jsou specifické pro použitou metodu záznamu. Obecně nejsou tyto různé metody záznamu navzájem kompatibilní. Struktura norem umožňuje, aby je bylo možné důsledně přizpůsobit existujícím i budoucím metodám záznamu.

Tato část ISO/IEC 11694 je zaměřena na optické paměťové karty, které používají lineární metodu záznamu. Charakteristiky, které se vztahují na další specifické záznamové metody, se nacházejí v samostatných normalizačních dokumentech.

Tato část ISO/IEC 11694 stanoví optické vlastnosti a charakteristiky a rozsah shody s příslušným základním dokumentem ISO/IEC 11693. Dále stanoví doplňky a/nebo odchylky od ISO/IEC 11693.

1 Předmět normy

Tato část ISO/IEC 11694 stanoví optické vlastnosti a charakteristiky optických paměťových karet, které používají lineární metodu záznamu.

-- Vynechaný text --